

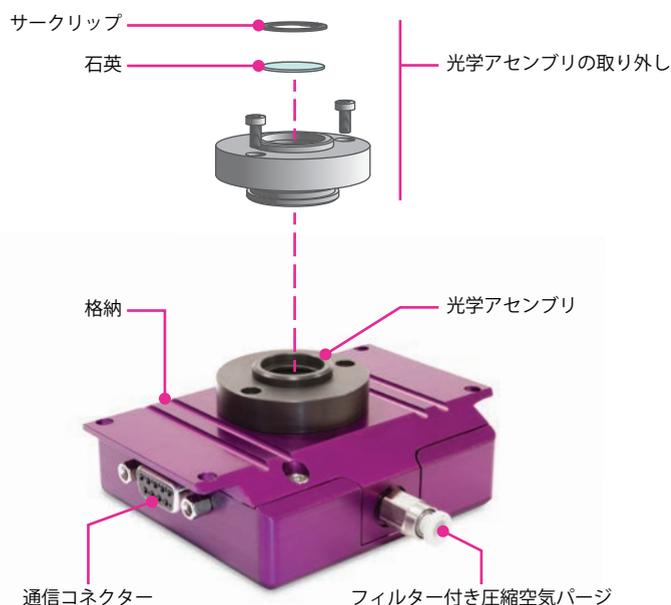
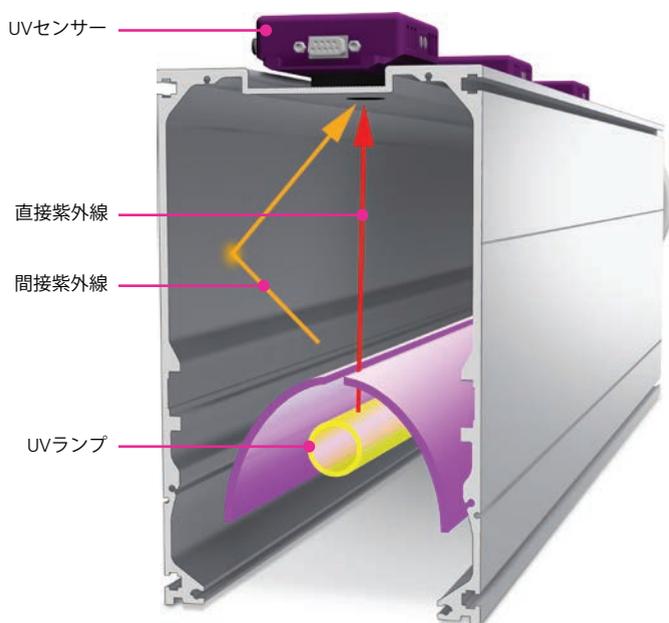
GEW mUVm

マルチポイントUVモニタリング

効果的なインク硬化がなされるかどうかは、UVランプからの保証された出力と反射板システムいかにです。GEWのmUVmは、1台から最大5台までのUVセンサーを設置することで、UVランプの出力を連続的にモニタリングすることが可能です。

シンプルなユーザーインターフェースでは、GEWのタッチスクリーンにランプのUV出力が表示されます。また、出力が低い、あるいは高い場合、アラームにて警告するように設定できます。ランプごとに最大5個のセンサーが、毎秒ごとにモニタリングするので、いままでにないUV硬化プロセスの制御が可能になりました。

- UVランプの耐用期間終了時期が簡単に確認可能
- バッチごとにUV検査を100%実施
- 欧州食品接触パッケージ規制へのコンプライアンスを向上



技術的な利点

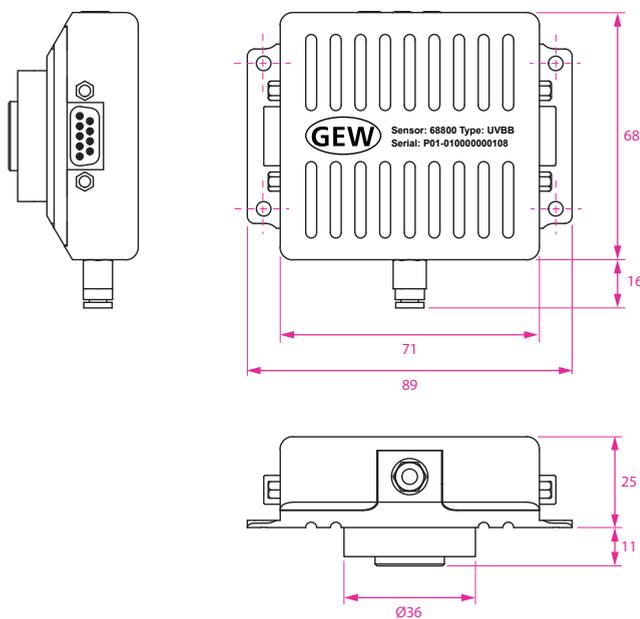
- 正確に出力されたUV値によりランプの交換時期が分かり、結果ランプの寿命を延ばします
- 硬化不良の製品発生リスクなしでランプの稼働電力を削減することにより、エネルギーを節約
- すべてのランプのUV出力をライブで記録することにより、バッチごとにUV硬化証明書を作成
- 食品接触包装に関する欧州法規制に準拠した設計
 - フレームワーク規則 (EC) 1935/2004 第3条
 - 製造管理および品質管理に関する基準規則(EC) 2023/2006
 - プラスチック規制 (EU) 10/2011
 - スイス条例SR 817.023.21



各ランプのUV強度は、グラフまたは表形式で表示することができます。ランプが設定ポイントに近づいたり、設定ポイントを超えたりした場合は、信号機の色で警告します。

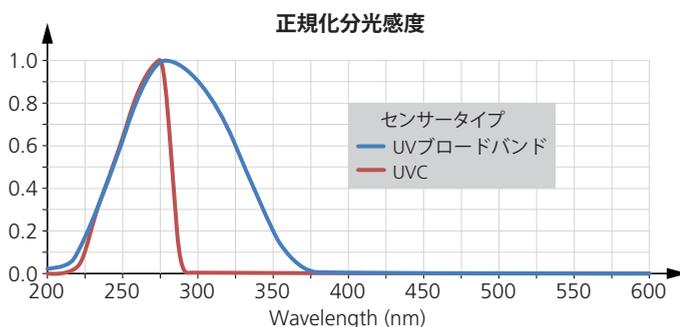
技術詳細

- すべてのセンサーに対応した独自の較正（シリアル化、およびPTB規格とのトレーサビリティ確保）
- 推奨稼働条件：5~40°C、相対湿度0~80%、非結露
- 較正の不確か性：±10%
- 最小センサーピッチ：150mm
- 測定単位：mW/cm²
- フィルター付き圧縮空気パージにより、汚れやホコリの侵入を防止
- 簡単に取り外しができる光学アセンブリにより、必要に応じた補足クリーニングが可能
- RHINO電源供給装置は、E2C、E2C HP 及び NUVA2 UVシステムのどれでも利用可能



オプション

- スペクトル範囲：UVCまたはUVブロードバンド
- ランプごとの複数のセンサー：1個を推奨、最大5個まで設置可能
- センサーの配置：ランプの幅全体での配置ならどこでも問題はないが、ランプの中心位置を推奨
- 最低年に1度の再較正を推奨



GEW mUVm-JPV1

Head office

GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, UK

UK +44 1737 824 500 Germany +49 7022 303 9769 USA +1 440 237 4439

E sales@gewuv.com W gewuv.com

